Elssn., G /

TQ114.1 TG407

# (22) \$79~ff2 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头界面晶体位向关系 对断裂能量的影响 \*

刘伟平 (大连铁道学院材料科学与工程系、大连 116028) G. Elssner, M. Rühle (Max-Planck Institute for Metal Research, Stuttgart, Germany)

**摘 要** 以单晶  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 陶瓷 (蓝宝石) 和单晶 Cu 为母材,采用真空扩散焊接获得具有两种不同的界面晶体位向关系的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头以及带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头。研究了界面晶体位向关系对接头断裂能量的影响, 结果表明、陶瓷 - 金属界面的晶体位向关系影响界面粘合动 ( $W_{ad}$ ) 和断裂过程中金属制所消耗的塑性变形功 ( $W_p$ )、从而显著影 响接头的断裂能量. 界面位向关系为 (100)[011]<sub>Cu</sub> # (0001)[1120]<sub>Al2O3</sub> 的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头断裂能量值最低、而具有相同位 向关系的带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头的断裂能量值则最高.

**关键词 陶瓷 / 金屑焊接、界面位向关系、断裂能量** 中图法分类号 TG457, TG496.7 文献标识码 A 文章编号 0412-1961(2000)08-0879-04

# EFFECTS OF THE CRYSTAL ORIENTATION RELATIONSHIP AT THE INTERFACE OF Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> JOINTS ON FRACTURE ENERGY

 LIU Weiping
Deptartment of Materials Science and Engineering, Dalian Railway Institute, Dalian 116028
G. Elssner, M. Rühle
Max-Planck Institute for Metal Research, Stuttgart, Germany
Correspondent: LIU Weiping, professor. Tel: (0411)4604323-2835, Fax: (0411)4606139, E-mail: lwp@dlrin.edu.cn.
Manuscript received 1999-11-24, in revised form 2000-04-28

**ABSTRACT** Single crystalline Cu and  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (sapphire) with different crystallographic orientation relationships at the interface were diffusion-welded in vacuum with and without a thin film Nb interlayer. Effects of the orientation relationship at the interface on the fracture energy of Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> diffusion-bonded joints were studied. Results show that the orientation relationship between Cu and  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> single-crystals at the interface remarkably influences the fracture energy of the metal/ceramic joint by changing both the work of adhesion of the metal-ceramic interface and the dissipated energy caused by plastic deformation of the metal side of the joint. The Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joints with the orientation relationship (100)[011]<sub>Cu</sub> # (0001)[1120]<sub>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> have the lowest fracture energy values, while the Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joints with the same orientation relationship between Cu and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> are the toughest among the tested joints.</sub>

**KEY WORDS** ceramic/metal welding, interface orientation relationship, fracture energy

随着高科技与经济建设的发展,高性能陶瓷材料的应

用受到世界各国的日益普遍重视。据估测、全世界高性能 陶瓷的销售额从 1995 到 2000 年的 5 年内增加了一倍、 至 2000 年约 530 亿美元<sup>[1]</sup>。高性能陶瓷的应用可带来 巨大的经济效益、如果在发动机上使用陶瓷材料。可使耐 温性能从 900 C提高到 1200—1300 C、提高发动机效率

<sup>\*</sup> 国家留学基金委员会资助项目 收到初稿日期: 1999-11-24,收到修改稿日期: 2000-04-28 作者简介: 刘伟平,男, 1963 年生,教授、博士

45%, 节能 30%—50%. 陶瓷材料虽然具有许多独特的优 点, 但存在脆性大的致命弱点. 将陶瓷和金属连接构成各 种类型的复合结构或复合材料, 是使材料和结构既具有陶 瓷耐热、耐磨和耐蚀的优越性, 又保持金属材料高韧性的 有效途径. 因此, 结构陶瓷的工程应用在很大程度上取决 于它与金属的连接问题. 另外, 陶瓷与金属连接及其界面 结合的研究也是金属 - 陶瓷复合材料研究中的重要研究 内容之一.

陶瓷 - 金属接头界面的晶体结构、化学成分和原子键 合不同于界面两侧的陶瓷和金属、界面的性质与界面两侧 的基体有很大差别. 陶瓷 - 金属界面的性质是决定其复 合材料或连接接头使用性能的重要因素之一.  $Al_2O_3$  陶 瓷与金属 Cu 的连接在工业应用中具有重要意义<sup>[2]</sup>、文献 [3] 曾研究了加 Nb 膜中间层对 Cu/Al\_2O\_3 界面接合强 度的影响,结果表明, Nb 膜中间层的加入显著地提高了 Cu/Al\_2O\_3 扩散焊接头的断裂能量. 在此基础上、本文以 单晶  $\alpha$ -Al\_2O\_3 陶瓷和单晶 Cu 为母材,研究了 Cu/Al\_2O\_3 扩散焊接头以及带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al\_2O\_3 扩散 焊接头界面晶体位向关系对接头断裂能量的影响.

#### 1 实验材料及方法

实验材料为单晶 Cu 和单晶  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (即蓝宝石, 纯 度大于 99.99%). 两种晶体在扩散焊接实验时采用的界面 位向关系为 (100)[011]<sub>Cu</sub> # (0001)[11 $\overline{2}0$ ]<sub>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></sub>(简称 A) 和 (111)[1 $\overline{1}0$ ]<sub>Cu</sub> # (0001)[11 $\overline{2}0$ ]<sub>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></sub>(简称 B). 为了获 得足够长的试样用于 4 点弯曲实验、在单晶 Cu 一侧用 多晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接长、而在单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 一侧连接多晶 Cu 片 再用多晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接长、试样装配如图 1 所示.

整个试样包含 4 个扩散焊界面,一次焊接完成.扩散焊 接实验是在德国 Max-Planck 金属研究所一台超高真空 扩散焊机上进行的.该机具有可以独立工作的样品表面清 理室 (preparation chamber)、表面蒸镀或掺杂室 (doping chamber) 以及扩散焊接室 (bonding chamber),如 图 2 所示.

被焊试样首先分别在丙酮和甲醇液中进行超声波清洗,并用高纯氮气吹干后装入焊机. 在样品表面清理室, 采用 Ar 离子轰击对所有待焊表面进行清理. 对 Cu 表面 采用 1.5 keV 能量 Ar 离子轰击 25 min, 对 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面 采用 3 keV 能量 Ar 离子轰击 30 min.

为了获得带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊 接头,在表面蒸镀室采用电子束蒸镀法(功率 9 kW)在 与单晶 Cu 相连接的单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面上蒸镀一层厚度为 30—180 nm 的 Nb 膜作中间层.膜厚由石英晶体振荡器 测定,蒸镀速率约为 0.2 nm/s.试样在焊接室装配定位 时,为保证单晶 Cu 与单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在界面上的晶体位向关 系,采用激光束对晶体抛光侧面进行反射监控、可将位向 误差控制在 ±0.1° 范围内.扩散焊接规范系数为:焊接温 度 900 ℃,保温时间 120 min,压力 8 MPa,加热和冷却 速率分别为 15 和 5 ℃ /min,真空度优于 1×10<sup>-6</sup> Pa. 焊 后将试样切割成 2 mm×4 mm×36 mm (每组 5 个试样) 后用于 4 点弯曲实验,并在试样的单晶 Cu 与单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 界面上用金刚石锯片开一宽度约为 140  $\mu$ m 的缺口,所有 试样缺口方向均沿单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 [11<u>2</u>0] 晶向. 缺口深 度与试样高度之比为 0.5. 弯曲实验时加载头位移速率为 96.8  $\mu$ m/min. 通过 4 点弯曲实验时加载头位移速率为 96.8  $\mu$ m/min. 通过 4 点弯曲实验获得具有不同位向关 系的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩 散焊接头界面断裂能量数据,并对 Nb 膜中间层的影响进 行了分析.



图 1 焊接试样装配示意图







Fig.2 Schematic of the ultra-high vacuum diffusion welding apparatus

 Specimens 2. Orientation device 3. Ceramic anvil 4. Heating zone 5. Mass spectrometer 200 u
Pumping unit 7. Auger spectrometer 8. Ion sputter guns (5° and 90°)
Mass spectrometer 100 u
Carousel 11. Thickness monitor 12. Electron beam evaporator 13. Shutter

## 2 实验结果及讨论

对 无 中 间 层 具 有 两 种 不 同 界 面 位 向 关 系 的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头的弯曲实验结果表明、界面位向 关系为 A 的接头断裂能量值为 70—152 J/m<sup>2</sup>,平均值 为 110 J/m<sup>2</sup>. 界面位向关系为 B 的接头断裂能量值为 98—176 J/m<sup>2</sup>,平均值为 135 J/m<sup>2</sup>,略高于界面位向关

#### 系为 A 的接头断裂能量.

图 3 为两种不同界面位向关系的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头断裂能量与 Nb 膜中间层厚度的关系. 当 Nb 膜中间层厚度为 30—180 nm 时、界面位向关系为 A 的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头的平均断裂能量值为 2180— 3602 J/m<sup>2</sup>,而界面位向关系为 B 的焊接接头平均断裂 能量值仅为前者的 1/2 左右. 在两种位向关系条件下, Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头的断裂能量值均随 Nb 膜厚度的增 如而降低.

由上述实验结果可见, 陶瓷 - 金属界面的晶体位向关 系对断裂能量有显著影响, 已知陶瓷 - 金属界面总的断裂 能量 G。是界面粘合功 (W<sub>ad</sub>)和金属侧所消耗的塑性变 形功 (W<sub>p</sub>) 之和, 可以用下式表示

$$G_{\rm c} = W_{\rm ad} + W_{\rm p} \tag{1}$$

根据文献 [4], W<sub>p</sub> 与 W<sub>ad</sub> 之间存在如下幂指数关系

$$W_{\rm p} = a(W_{\rm ad})^n \tag{2}$$

其中 α 为系数.

对于具有低粘合功的弱界面、塑性变形仅发生在裂纹 尖端附近的微观区域内,界面断裂为脆性. 当界面粘合功 超过某一值后、由金属侧塑性变形而消耗的断裂能量以幂 指数速度迅速增长、一方面,两种材料在界面的不同晶体 位向关系对应不同的界面粘合功; 另一方面,界面的晶体 位向关系决定了金属侧晶体的滑移系与断裂时作用应力 方向间的夹角、从而也必然影响到断裂过程中金属侧所消 耗的塑性变形功、

面心立方晶体 Cu 的 III 晶面以及密排六方 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 晶体的 0001 晶面均为各自晶体的密排面. Mulder 等<sup>[5]</sup>



图 3 不同界面位向关系的带有不同厚度 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头断裂能量比较

Fig.3 Comparison of fracture energies of Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joints for two different orientation relationships as a function of Nb interlayer thickness

研究了在 1067 C 扩散连接的单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 与多晶 Cu 的 接头界面,发现经扩散焊后在界面上多晶 Cu 的 111 面 平行于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的基面 0001.

Dehm<sup>[0]</sup> 的研究也表明通过分子束外延 (MBE) 方法 在单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 0001 基面上获得的 Cu 膜也具有相同 的晶面取向关系. 由此可以推知, 本研究中的界面位向关 系 B 应为能量最低的界面位向关系、其界面粘合功应大 于界面位向关系 A 的粘合功值.

再从金属侧的塑性变形来分析 由于弯曲实验时应力 方向与界面垂直,可以计算出界面位向关系为 A 的 Cu 侧可能开动的滑移系有 8 个,其 Schmid 因子(取向因子) 是  $1/\sqrt{6}$  (Schmid 因子值越大、越有利于塑性变形).而 对于界面位向关系为 B 的 Cu 侧,可能开动的滑移系只 有 6 个,其 Schmid 因子是  $2/(3\sqrt{6})$ .因此,界面位向关 系为 A 的接头更有利于金属侧的塑性变形.但是,塑性 变形功  $W_p$  对断裂能量的实际贡献还与粘合功的大小有 关.由于上述多方面综合作用的结果,在无 Nb 膜中间层 的条件下,界面位向关系为 B 的接头断裂能量仅稍高于 界面位向关系为 A 的接头断裂能量.

对于带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头、陶瓷 - 金属的界面粘合功变为 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 与 Nb 膜中间层的界面 粘合功. 过去研究曾表明 <sup>[3]</sup>、在单晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 0001 面 上蒸镀的 Nb 膜具有织构、其密排面 110 平行于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 0001 基面.

对于 Cu 与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 具有不同晶体位向关系的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头、粘合功( $W_{ad}$ )是相同的、即为 Nb(110)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(0001)界面粘合功。同时、粘合功对塑 性变形的影响也是相同的。由于界面位向关系为 A 的金 属侧更有利于塑性变形、其塑性变形功  $W_{\mu}$  对断裂能量的 贡献更大、因此界面位向关系为 A 的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接 头的断裂能量值大于位向关系为 B 的接头断裂能量.

值得指出、带 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头的断裂能量显著高于无中间层的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头. 这是 由于 Nb 与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的界面粘合功大于 Cu 与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 粘合功、而且由于 Nb 与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 较强的键合使断裂时金 属侧所消耗的塑性变形功以幂指数速度迅速增长.

图 4 示出带有 60 nm 厚的 Nb 膜中间层的 Cu(100)/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0001) 接头断口形貌. 由图可见、在 Cu 侧的断口表面 (见图 4b) 以及在陶瓷侧的残留 Cu 点 上 (见图 4a) 存在大量浅韧窝,表明界面断裂为韧性断 裂. 这种界面断裂机理示意如图 5a 所示,表现为在界面 处的金属中微孔形成和聚集连接直至断裂的过程.而由于 Cu 与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的界面结合强度较弱,无 Nb 膜中间层的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头的断裂则表现为较脆性的界面分离,如图 5b 所示.在这种情况下,塑性变形仅限于裂纹尖端附近塑 性区 因此,断裂所消耗的塑性变形功大大低于前者.



图 4 带有 60 nm 厚的 Nb 膜中间层的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头断口形貌 Fig.4 SEM micrographs of fracture surfaces from a Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joint with 60 nm thick Nb interlayer (a) the Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> side where residual Cu was residing (b) the Cu side



图 5 两种陶瓷 - 金属界面断裂形式示意图

Fig.5 Schematic of two types of interface fracture in metal/ceramic joints

(a) ductile fracture (b) brittle fracture

# 3 结论

(1) 陶瓷 - 金属界面的晶体位向关系影响界面粘合功 和断裂时金属侧所消耗的塑性变形功、从而影响其接头断 裂能量值.

(2) 具有 (111) [110]<sub>Cu</sub> # (0001) [1120] Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 界面 位向关系的 Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头的断裂能量高于位向 关系为 (100) [011]<sub>Cu</sub> 〃 (0001) [11<u>7</u>0] <sub>Al2</sub>O<sub>3</sub> 的接头断 裂能量.

(3) 具有 (100)[011]<sub>Cu</sub> # (0001)[1120]<sub>Al2O3</sub> 界面 位向关系的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 扩散焊接头的断裂能量显著 高于位向关系为 (111)[110]Cu # (0001)[1120]AbO3 的 Cu/Nb/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接头断裂能量.

本研究工作是在德国 Max-Planck 金属研究所完成的、特此 致谢.

### 参考文献

- [1] Huang Y, Wu J G. Mater Sci Prog, 1990; 4(2): 150 (黄 勇、吴建光 材料科学进展、1990;4(2):150)
- [2] Beraud C, Courbiere M, Esnonf C, Juve D, Treheux D. J Mater Sci. 1989; 24: 4545
- [3] Liu W, Elssner G, Ruehle M. Mater Sci Eng, 2000 (in press)
- [4] Jokl M L, Vitek V, McMahon Jr C J. Acta Metall, 1980; 28: 1479
- [5] Mulder C A M, Klomp J T. J Phys, 1985; C4: 111
- [6] Dehm G. Ph D Dissertation, University of Stuttgart, Stuttgart, 1995